

Funkční vzorek

Zařízení pro měření statických charakteristik bipolárních tranzistorů



- ✓ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, č.j. 04944/11-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů v roce 2011“ je uplatňován funkční vzorek „Zařízení pro měření statických charakteristik bipolárních tranzistorů“.
- ✓ Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti s řešením v rámci specifického výzkumu.
- ✓ Zařízení umožňuje měřit jednotlivé statické charakteristiky PNP a NPN bipolárních tranzistorů (vstupní, převodní a výstupní charakteristiky).
- ✓ Součástí funkčního vzorku je patice pro snadnou výměnu měřených THT bipolárních tranzistorů.
- ✓ Funkční vzorek obsahuje stabilizátor napětí s filtrem pro zajištění stabilního napájecího napětí bez zarušení.
- ✓ Testování se provádí pro nastavené hodnoty vstupních nebo výstupních veličin (napětí a proudu).
- ✓ Funkční vzorek obsahuje proměnné rezistory k nastavení požadovaného vstupního a výstupního proudu tranzistoru. Součástí jsou také ochranné prvky k zamezení zničení měřeného tranzistoru.
- ✓ Součástí funkčního vzorku jsou konektory pro připojení měřících přístrojů a zdrojů napájecího napětí.

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

22130 – FV007– 2011

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.

tel.: 377 634 544

tblesi@ket.zcu.cz

ŘEŠITELSKÉ

PRACOVNÍŠTĚ:

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Katedra technologií a měření

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň